



LIST-MAGNETIK

## ポータブル型低透磁率計 フェロマスタ



フェロマスタは透磁率が 1.001 から 1.999 の弱磁性材料や工作物の比透磁率  $\mu_r$  が簡単に測定できる計器です。プローブチップで工作物に触れることで測定値がディスプレイに表示されます。代表的な応用はステンレス鋼の品質管理、電子／イオンビーム装置の材料選択、機械的・熱的ストレスによって生じた材料の欠損個所の検出などの非破壊検査です。

フェロマスタによる測定は透磁率の低い(1.0~20.)材料の比透磁率の測定について定めている最新の IEC 60404-15 及び ASTM A342M 規格に準拠しています。

### 〔 特徴 〕

- 操作が簡単
- 測定レンジ  $\mu_r = 1.001-1.999$
- IEC 60404-15 & ASTM A342M 準拠
- NPL 作られた精密標準で校正
- 校正用サンプルディスク付属
- 3 1/2 digit LC ディスプレイ
- 表示値の保持機能あり
- 防滴ケース (IP65)

### 〔 応用 〕

- ステンレスの品質管理
- 材料や加工中の製品の非破壊検査
- 電子ビームやイオンビームを用いた装置及び NMR 装置用の材料選択
- 材料中の強磁性体の検出
- 磁性体として異方性の材料の調査
- ストレスによる材料の欠損の検出

ARF ジャパン株式会社

[www.arf-japan.com](http://www.arf-japan.com)

## [ 仕様 ]

測定レンジ	$\mu = 1.001-1.999$
分解能	0.001
校正精度 @20°C	$(\mu - 1) \times 5\%$
動作温度	0~50 °C
プローブチップの磁界強度	~35 kA/m
バッテリー	9V アルカリ電池
連続使用時間	約 50 時間
本体寸法	約 151H × 82W × 33D mm
センサーケーブル長	約 1.5 m
重量	約 280 g



サンプルディスク

## [ 取り扱い注意事項 ]

### ◆ プローブを強磁場に曝さない

プローブは原理上永久磁石を内蔵していますので、強磁場に絶対に曝さないでください。スイッチオフの保存時にも地磁気以上の磁場環境中に放置しないでください。

### ◆ プローブチップに機械的ストレスを与えない

測定はプローブチップを測定サンプルの表面に垂直に軽く当てる程度で実施し、それ以上の機械的ストレスをプローブチップにかけないでください。

### ◆ 測定サンプルの残留磁気について

測定サンプルの残留磁気の影響を避けるために測定前にサンプルを消磁することをお勧めします。

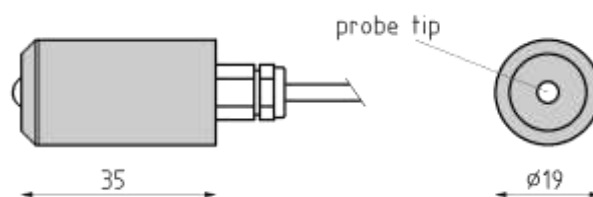
### ◆ 測定サンプルの表面について

正確な測定のためにはプローブチップを測定サンプルの表面に垂直に当ててください。測定サンプルが小さい場合や表面が平坦でない場合は誤差の原因となります。

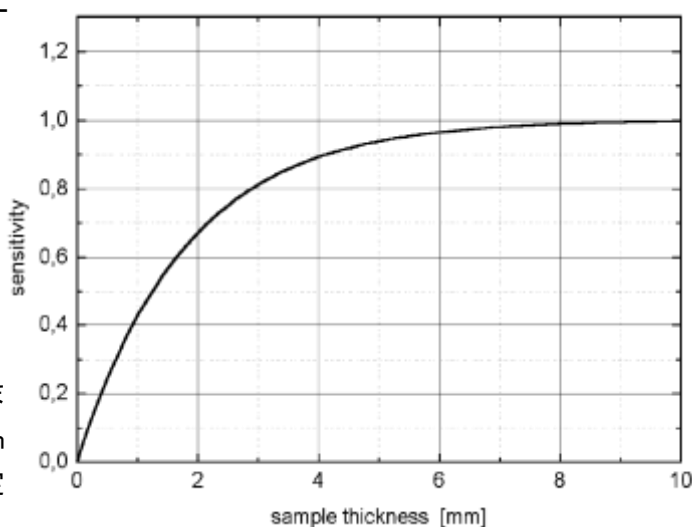
### ◆ 測定サンプルの寸法について

小さいサンプルの測定結果はその寸法に依存しません。測定結果が寸法に依存しないためには 5mm 以上の厚みと 2cm 以上の直径が必要です。測定サンプルの厚みと感度の関係を右図に示します。

## [ プローブ寸法 ]



## [ サンプルの厚みと感度 ]



■仕様は予告なく変更されることがあります

代理店

ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103  
 TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049  
 e-mail: sales@arf-japan.com  
 http://www.arf-japan.com